PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-005460

(43)Date of publication of application: 14.01.1994

(51)Int.CI.

H01G 4/12 C04B 35/46

H01B 3/12

(21)Application number: 03-076951

(71)Applicant: TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing:

16.03.1991 (72)Inven

(72)Inventor: KISHI HIROSHI

SAITO HIROSHI

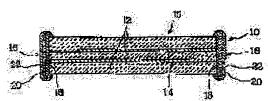
SHIZUNO HISAMITSU NISHI TOUSHI

ARAI KATSUHIKO

(54) PORCELAIN CAPACITOR AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide reliability -X7R characteristic (B characteristic) - for a DC breakdown voltage at a highest available temperature, and a small size and to reduce an irregularity in the voltage by forming a dielectric porcelain composition of sintered material of special ceramic particles. CONSTITUTION: A porcelain capacitor 10 comprises a dielectric layer 12 containing one or two or more of dielectric porcelain compositions, and two or more layers of inner electrode 14 so formed as to hold the dielectric layer. The composition is formed of a sintered material of ceramic particles. Core parts of the particles are almost formed of BaTiO3. A shell part of the particle is formed of BaTiO3 in which oxide of one or two or more types of elements selected from Mg, Cd, Sr and Zn, and oxide of one or two or more types of elements selected from Sc, Y, Ga, Dy, Ho, Er, Yb, Tb, Tm and Lu are solid- dissolved. Thus, an irregularity in a DC breakdown voltage is reduced, and its level is improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.04.1993

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2132860

[Date of registration]

24.10.1997

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-5460

(43)公開日 平成6年(1994)1月14日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

厅内整理番号

FI

技術表示箇所

H01G 4/12

358

C 0 4 B 35/46

D

H 0 1 B 3/12

303

9059-5G

請求項の数7(全 11 頁) 審查請求 有

(21)出願番号

特願平3-76951

(71)出願人 000204284

太陽誘電株式会社

東京都台東区上野 6丁目16番20号

(22)出願日

平成3年(1991)3月16日

(72) 発明者 岸 弘志

東京都台東区上野 6丁目16番20号 太陽誘

雷株式会社内

(72)発明者 斎藤 博

東京都台東区上野 6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内

(72)発明者 静野 寿光

東京都台東区上野 6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内

(74)代理人 弁理士 窪田 法明

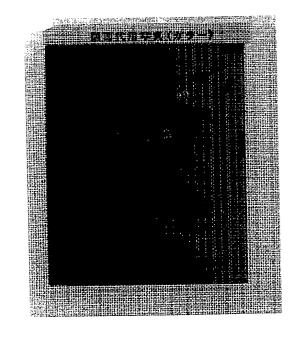
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 磁器コンデンサ及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 X7R特性 (B特性)を有し、小型で、しか も125℃における直流破壊電圧のバラツキが少ない単 層または積層構造の磁器コンデンサを提供すること。

誘電体磁器組成物からなる1又は2以上の誘 【構成】 電体層と、この誘電体層を挟むように形成された2以上 の内部電極とを備えた磁器コンデンサにおいて、前記誘 電体磁器組成物がセラミック粒子の焼結体からなり、こ のセラミック粒子のコア部が殆どBaTiO3からな り、このセラミック粒子のシェル部が、Mg, Ca, S r及びZnから選択された1種又は2種以上の元素の酸 化物と、Sc, Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, T b, Tm及びLuから選択された1種又は2種以上の元 素の酸化物とを固溶したBaTiO3からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体磁器組成物からなる1又は2以上の誘電体層と、この誘電体層を挟むように形成された2以上の内部電極とを備えた磁器コンデンサにおいて、前記誘電体磁器組成物がセラミック粒子の焼結体からなり、このセラミック粒子のコア部が殆どBaTiO3からなり、このセラミック粒子のシェル部が、Mg, Ca, Sr及びZnから選択された1種又は2種以上の元素の酸化物と、R2O3(但し、RはSc, Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Tb, Tm及びLuから選択した1種又は2種以上の元素)で表わされる酸化物とを固溶したBaTiO3からなることを特徴とする磁器コンデンサ。

【請求項2】 前記セラミック粒子のシェル部にZrO 2 が固溶していることを特徴とする請求項1記載の磁器 コンデンサ。

【請求項3】 前記内部電極がNiを主成分とする材料によって形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の磁器コンデンサ。

【請求項4】 基本成分の原料粉末を調製する工程と、この基本成分の原料粉末を所定の温度で仮焼する工程と、この仮焼によって得られた基本成分の粉末に添加成分の粉末及び有機バインダーを混合してスラリーを形成する工程と、このスラリーをシート状に成形して未焼結磁器シートを形成するとともに、この未焼結磁器シートを挟むように導電性ペースト膜を形成して積層物を得る工程と、この積層物を非酸化性雰囲気中において焼成する工程と、この積層物を酸化性雰囲気中において熱処理する工程とを備え、

前記基本成分が、主成分である $BaTiO_3$ に、MgO, CaO, SrO及びZnOから選択された1種又は2種以上の酸化物と、 R_2O_3 (但し、RはSc, Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Tb, Tm及びLuから選択された1種又は2種以上の元素)で表わされる酸化物と、前記基本成分及び添加成分全体におけるモル比(Ba+Mg+Ca+Sr+Zn)/ (Ti+R)をkとして、 $1.00 \le k \le 1.04$ となるように加えたBaO及び/又は TiO_2 とからなり、

前記添加成分が、 Li_2 O $-SiO_2$ -MeO又は B_2 O $_3$ $-SiO_2$ -MeO(但し、MeはBa,Ca,Sr,Mg及びZnから選択された1種又は2種以上の元素)からなることを特徴とする磁器コンデンサの製造方法。

【請求項5】 基本成分の第1成分の原料粉末を調製する工程と、この第1成分の原料粉末を所定の温度で仮焼する工程と、この仮焼によって得られた基本成分の第1成分の粉末に基本成分の第2成分の粉末、添加成分の粉末及び有機バインダーを混合してスラリーを形成する工程と、このスラリーをシート状に成形して未焼結磁器シートを形成するとともに、この未焼結磁器シートを挟む50

ように導電性ペースト膜を形成して積層物を得る工程 と、この積層物を非酸化性雰囲気中において焼成する工 程と、この積層物を酸化性雰囲気中において熱処理する 工程とを備え、

前記基本成分の第1成分の原料粉末が、主成分であるBaTiO3と、MgO, CaO, SrO及びZnOから選択された1種又は2種以上の酸化物の粉末と、R2O3(但し、RはSc, Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Tb, Tm及びLuから選択された1種又は2種以上の元素)で表わされる酸化物の粉末と、前記基本成分及び添加成分全体におけるモル比(Ba+Mg+Ca+Sr+Zn)/(Ti+R)をkとして、1.00 \leq k \leq 1.04となるように加えたBaO及び/又はTiO2の酸化物の粉末とからなり、

前記基本成分の第2成分がCaZrO3及び/又はBaZrO3からなり、

前記添加成分が、 Li_2 O $-SiO_2$ -MeO又は B_2 O $_3$ $-SiO_2$ -MeO (但し、Me はBa , Ca , S r , Mg , Zn から選択された 1 種又は 2 種以上の元素)からなることを特徴とする磁器コンデンサの製造方法。

【請求項6】 前記添加成分がCr2 O3 及び/又はA 12 O3 を含有していることを特徴とする請求項4又は 5記載の磁器コンデンサの製造方法。

【請求項7】 前記導電性ペーストがNiを主成分とする材料によって形成されていることを特徴とする請求項4~6記載の磁器コンデンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、BaTiO3を主成分とする誘電体磁器組成物からなる1又は2以上の誘電体層と、この誘電体層を挟むように形成された2以上の内部電極とを備えた単層又は積層構造の磁器コンデンサ及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】積層構造の磁器コンデンサは、一般に、誘電体層を形成する未焼結磁器シートと、内部電極を形成する導電性ペースト膜とを交互に積層し、これらを酸化性雰囲気中において1300~1600℃の温度で焼成することにより製造されていた。このため、内部電極の材料としては酸化性雰囲気中における焼成によって酸化しない白金やパラジウム等の高価な貴金属を用いなければならず、磁器コンデンサがコスト高になっていた。【0003】ところで、磁器コンデンサのコストダウンを図るために、内部電極の材料としてNi等の卑金属を用い、Niの酸化を防止するために、還元性雰囲気中において焼成することが考えられる。しかし、これまで知られていた誘電体磁器組成物の原料を還元性雰囲気中において焼成したのでは、所望の電気的特性を有する誘電体磁器組成物を得ることができない。

4 ラツキが少ない単層または積層構造の磁器コンデンサ及

ラッキか少ない単層または積層構造の磁器コンテンック びその製造方法を提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】この出願に係る磁器コンデンサは、誘電体磁器組成物からなる1又は2以上の誘電体層と、この誘電体層を挟むように形成された2以上の内部電極とを備えた磁器コンデンサにおいて、前記誘電体磁器組成物がセラミック粒子の焼結体からなり、このセラミック粒子のコア部が殆どBaTiO3からなり、このセラミック粒子のシェル部が、Mg, Ca, Sr及びZnから選択された1種又は2種以上の元素の酸化物と、Sc, Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Tb, Tm及びLuから選択された1種又は2種以上の元素の酸化物とを固溶したBaTiO3からなることを特徴とするものである。

【0011】ここで、セラミック粒子のコア部とは、セラミック粒子の内部の部分をいい、シェル部とは、セラミック粒子の外殻部をいう。また、セラミック粒子のシェル部には、ZrO2が固溶していてもよいし、また、固溶していなくてもよい。更に、前記内部電極はNiを主成分とする導電材料によって形成することができるが、これ以外の金属を使用することも可能である。

【0012】また、この出願に係る磁器コンデンサの製 造方法は、基本成分の原料粉末を調製する工程と、この 基本成分の原料粉末を所定の温度で仮焼する工程と、こ の仮焼によって得られた基本成分の粉末に添加成分の粉 末及び有機バインダーを混合してスラリーを形成する工 程と、このスラリーをシート状に成形して未焼結磁器シ ートを形成するとともに、この未焼結磁器シートを挟む ように導電性ペースト膜を形成して積層物を得る工程 と、この積層物を非酸化性雰囲気中において焼成する工 程と、この積層物を酸化性雰囲気中において熱処理する 工程とを備え、前記基本成分が、主成分であるBaTi O3 に、MgO, CaO, SrO及びZnOから選択さ れた1種又は2種以上の酸化物と、R2 O3 で表わされ る酸化物(但し、RはSc, Y, Gd, Dy, Ho, E r, Yb, Tb, Tm及びLuから選択された1種又は 2種以上の元素)と、前記基本成分及び添加成分全体に おけるモル比 (Ba+Mg+Ca+Sr+Zn) / (T i+R) をkとして、1.00≦k≦1.04となるよ うに加えたBaO及び/又はTiO2 とからなり、前記 添加成分が、Li2 O-SiO2 -MeO又はB2 O3 -SiO₂ -MeO (但し、MeはBa, Ca, Sr, Mg及びZnから選択された1種又は2種以上の元素) からなるものである。

【0013】また、この出願に係る別の磁器コンデンサの製造方法は、基本成分の第1成分の原料粉末を調製する工程と、この第1成分の原料粉末を所定の温度で仮焼する工程と、この仮焼によって得られた基本成分の第1

【0004】例えば、特開昭61-275164号公報には、BaTiO3にNb2O5とCo2O3を添加した原料粉末を用い、酸化性雰囲気中において焼成することによって、誘電率の大きな、静電容量の温度変化率の小さな誘電体磁器組成物が得られることが開示されているが、この原料粉末を用い、還元性雰囲気中において焼成したのでは、焼成物が容易に半導体化されてしまい、所望の電気的特性を有する誘電体磁器組成物を得ることができない。

【0005】そこで、本件出願人は、還元性雰囲気中に 10 おける焼成によって得られるものであって、誘電率の高い、静電容量の温度変化率の小さな誘電体磁器組成物として、特公昭61-14607~14611号公報、特公昭62-1595,1596号公報に開示されているものを提案した。更に、本件出願人は、これらの出願に係る誘電体磁器組成物の電気的諸特性を改善するものとして、特願平1-311094~311098号、特願平1-314754~314756、特願平1-315981~315983号、特願平2-016345、特願平2-76761~76768、特願平2-7677 203~76776の各特許出願に開示されているものを提案した。

【0006】これらの特許出願に係る誘電体磁器組成物の内容を要約すると、いずれも基本成分の第1成分を (Ba_{k-x} M_x) O_k ・(Ti_{1-y} R_y) $O_{2-y/2}$ の形

で表わすことができ、基本成分の第2成分としては何も用いないか、 $CaZrO_3$ 又は $BaZrO_3$ のいずれかを用い、更に添加成分の第1成分としては、 Li_2O-SiO_2-MeO 又は $B_2O_3-SiO_2-MeO$ を用い、添加成分の第2成分としては、何も用いないか、 Cr_2O_3 と Al_2O_3 のうちの少なくとも一方を用いるものである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、電子 回路の高密度化に伴い、積層磁器コンデンサの小型化に 対する要求は非常に強い。積層磁器コンデンサを小型化 する方法としては、誘電体層の厚みを薄くし、積層数を 多くする方法が知られている。しかし、誘電体層の厚み を薄くし過ぎると直流破壊電圧がバラツキ、磁器コンデ ンサの耐電圧に対する信頼性が維持できなくなってしま う。

【0008】例えば、X7R特性(B特性)を要求される積層磁器コンデンサにおいては、特に最高使用温度である125℃における直流破壊電圧に対する信頼性が重要視されているが、前述した特許出願における誘電体磁器組成物では厚みを薄くし過ぎると、125℃における直流破壊電圧がバラツキ、この温度における耐電圧に対する信頼性が維持できなくなってしまう。

【0009】この発明は、X7R特性(B特性)を有 る工程と、この第1成分の原料粉末を所定の温度で仮焼 し、小型で、しかも125℃における直流破壊電圧のバ 50 する工程と、この仮焼によって得られた基本成分の第1 (4)

20

Tm及びLu)が誘電体磁器組成物中において局所的に

成分の粉末に基本成分の第2成分の粉末、添加成分の粉 末及び有機バインダーを混合してスラリーを形成する工 程と、このスラリーをシート状に成形して未焼結磁器シ ートを形成するとともに、この未焼結磁器シートを挟む ように導電性ペースト膜を形成して積層物を得る工程 と、この積層物を非酸化性雰囲気中において焼成する工 程と、この積層物を酸化性雰囲気中において熱処理する 工程とを備え、前記基本成分の第1成分の原料粉末が、 主成分であるBaTiO3と、MgO, CaO, SrO 及びΖnOから選択された1種又は2種以上の酸化物の 10 粉末と、 R_2 O_3 で表わされる酸化物(但し、RはSc, Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Tb, Tm及 びLuから選択された1種又は2種以上の元素)の粉末 と、前記基本成分及び添加成分全体におけるモル比(B a+Mg+Ca+Sr+Zn) / (Ti+R) をkとし て、1.00≤k≤1.04となるように加えたBaO 及び/又はTiO2の酸化物の粉末とからなり、前記基 本成分の第2成分がCaZrО3 及び/又はBaZrO 3 からなり、前記添加成分が、 $Li_2 O-SiO_2-M$ e O 又はB₂ O₃-SiO₂ -MeO(但し、MeはB a, Ca, Sr, Mg, Znから選択された1種又は2 種以上の元素) からなるものである。

【0014】ここで、前記2つの製造方法において、添 加成分はCr2 O3 及び/又はAl2 O3 を含むものを 使用してもよいし、使用しなくてもよい。また、前記2 つの製造方法において、導電性ペーストはNiを主成分 とする材料によって形成することができるが、これ以外 の金属を使用することも可能である。

【0015】また、前記2つの製造方法において、基本 成分の第1成分の仮焼温度は800~1100℃が好ま しい。800℃未満ではBaCO3等の分解が不十分 で、反応が不均一になり易く、1100℃を越えると粒 成長及び凝集が始まり、焼結性の低下を生ずるからであ る。

【0016】また、前記2つの製造方法において、基本 成分の第1成分に用いるBaTiO3 は純度が99%以 上のもので、粒径は0.5μmから2.0μmのものが 好ましい。 0. 5 μ m未満では反応が進み過ぎて固溶状 態となり、2.0μmを越えると焼結性が低下してしま うからである。また、1.00≦k≦1.04としたの は、k<1.00では誘電体磁器組成物が半導体化して しまい、k>1.04では誘電体の緻密化が困難となる からである。

[0017]

【作用】従来の製造方法においては、基本成分の第1成 分(Bak-x Mx)Ok ・(Til-y Ry)O2 を合成 する場合、それぞれの成分原料をすべて混合して一度に 反応させていたので、反応が不均一となり易く、特に少 量成分のM成分(Ca, Sr, Mg及びZn)及びR成 分(Sc, Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Tb,

偏析し、組成に大きなバラツキを生じていた。 【0018】この発明においては、あらかじめ合成され ているBaTiO3にBa, M成分, Ti, R成分を所 定の組成割合になるように加えて混合して熱処理するの で、BaTiO3 に対して添加成分が均一に反応し、M 成分、R成分の組成のバラツキが抑制される。

[0019]

【実施例】まず、実施例1について説明する。あらかじ め合成されている純度99%以上のBaTiO3(チタ ン酸バリウム) 0.96モル部、純度99%以上のMg 〇(酸化マグネシウム)0.05モル部、乙n〇(酸化 亜鉛) 0.01モル部、TiO2 (酸化チタン) 0.0 3モル部、Ho2 O3 (酸化ホルミウム) 0.005モ ル部をそれぞれ秤量し、これらの化合物をポットミル に、アルミナボール及び水2.5リットルとともに入 れ、15時間攪拌混合して混合物を得た。

【0020】次に、この混合物をステンレスポットに入 れ、熱風式乾燥器を用い、150℃で4時間乾燥し、こ の乾燥した混合物を粗粉砕し、この粗粉砕した混合物を トンネル炉を用い、大気中において約1200℃で2時 間仮焼し、基本成分の第1成分である(B a 0.96M g 0.05Zn0.01) O_{1.02} (Ti_{0.99}Ho_{0.01}) O_{1.995} σ 粉末を得た。

【0021】次に、この第1成分の粉末98モル部及び CaZrO3 (基本成分の第2成分)の粉末2モル部を 各々秤量し、これらの基本成分100重量部に対して添 加成分の第1成分(O. 20Li2 O-0. 60SiO 2-0.04 SrO-0.10 MgO-0.06 ZnO) 2重量部を添加し、アクリル酸エステルポリマー、 グリセリン、縮合リン酸塩の水溶液からなる有機バイン ダを基本成分と添加成分の合計重量に対して15重量% 添加し、更に、50重量%の水を加え、これらをボール ミルで粉砕混合してスラリーを作成した。

【0022】次に、このスラリーを真空脱泡機に入れて 脱泡し、リバースロールコータに入れて薄膜成形物を形 成し、これを長尺なポリエステルフィルム上に連続して 受け取らせ、この薄膜成形物を同フィルム上で100℃ に加熱して乾燥させ、厚さ約25μmの未焼結磁器シー トを得た。このシートは長尺なものであるが、これを1 0 c m角の正方形に裁断して使用する。

【0023】一方、内部電極用の導電性ペーストは、粒 径平均1.5μmのニッケル粉末10gと、エチルセル ロース0.9gをブチルカルビトール9.1gに溶解さ せたものとを攪拌機に入れ、10時間攪拌することによ り得た。そして、この導電性ペーストを長さ14mm、 幅7mmのパターンを50個有するスクリーンを介して 上記未焼結磁器シートの片側に印刷した後、これを乾燥 させた。

【0024】次に、上記印刷面を上にして未焼結磁器シ 50

-

ートを2枚積層した。この際、隣接する上下のシートにおいて、その印刷面がパターンの長手方向に約半分程ずれるように配置した。そして、この積層物の上下両面にそれぞれ4枚ずつ厚さ60μmの未焼結磁器シートを積層し、約50℃の温度で厚さ方向に約40トンの荷重を加えて圧着させ、しかる後、この積層物を格子状に裁断して、50個の積層体チップを得た。

【0025】次に、この積層体チップを雰囲気焼成が可能な炉に入れ、大気雰囲気中において100℃/hの速度で600℃まで昇温して、有機バインダを燃焼させ、その後、炉の雰囲気を大気からH2 (2体積%)+N2(98体積%)の還元性雰囲気に変えた。

【0026】そして、炉をこの還元性雰囲気とした状態を保って、積層体チップの加熱温度を600℃から焼結温度の1150℃まで、100℃/hの速度で昇温して1150℃(最高温度)を3時間保持した後、100℃/hの速度で600℃まで降温し、雰囲気を大気雰囲気(酸化性雰囲気)におきかえて、600℃を30分間保持して酸化処理を行い、その後、室温まで冷却して積層焼結体チップを得た。

【0027】次に、電極が露出する積層焼結体チップの側面に亜鉛とガラスフリット(glass frit)とビヒクル(vehicle)とからなる導電性ペーストを塗布して乾燥し、これを大気中において550℃の温度で15分間焼付け、亜鉛電極層を形成し、更にこの上に無電解メッキ法で銅層を形成し、更にこの上に電気メッキ法でPbーSn半田層を設けて、一対の外部電極を形成した。

【0028】これにより、図4に示すように、3層の誘電体磁器層12と2層の内部電極14とからなる積層焼結体チップ15に一対の外部電極16を形成した積層磁 30器コンデンサ10が得られた。ここで、外部電極16は、亜鉛電極層18と、この亜鉛電極層18の上に形成された銅層20と、この銅層20の上に形成されたPbーSn半田層22とからなる。

【0029】なお、この積層磁器コンデンサ10の誘電体磁器層12の厚さは0.02mm、一対の内部電極14の対向面積は5mm×5mm=25mm²である。また、焼結後の誘電体磁器層12の組成は、焼結前の基本成分及び添加成分の混合組成と実質的に同じである。

【0030】次に、積層磁器コンデンサ100電気的特性を測定し、その平均値を求めたところ、表2に示すように、比誘電率 ϵ_S が3950、 t an δ が1. 2%、抵抗率 ρ が5. 3×10^6 M Ω ·cm 、25 Cの静電容量を基準にした-55 C及び+125 Cの静電容量の変化率 ΔC -55 , ΔC 125 が-10. 1%, +3. 5%、20 Cの静電容量を基準にした-25 C, +85 Cの静電容量を基準にした-25 C, +85 Cの静電容量の変化率 ΔC -25 , ΔC 85が-3. 6%, -4. 2%、125 Cの直流破壊電圧の平均値が64 V/ μ m、最小値が55 V/ μ mであった。

【0031】なお、電気的諸特性は次の要領で測定し

た。
(A) 比誘電率 ε_S は、温度 2 0 ℃、周波数 1 k H z、電圧(実効値) 1. 0 V の条件で静電容量を測定し、この測定値と、一対の内部電極 1 4 の対向面積 2 5 m m²と、一対の内部電極 1 4 間の誘電体磁器層 1 2 の厚さ 0. 0 2 m m から計算で求めた。

[0032] (B) 誘電体損失 $tan\delta$ (%) は上記比誘電率 ϵ_S の測定と同一条件で測定した。

【0033】(C) 抵抗率ρ (MΩ・cm) は、温度20 ℃においてDC100Vを1分間印加した後に一対の外 部電極16,16間の抵抗値を測定し、この測定値と寸 法とに基づいて計算で求めた。

【0034】(D) 静電容量の温度特性は、恒温槽の中に 試料を入れ、-55℃, -25℃, 0℃, +20℃, + 25℃, +40℃, +60℃, +85℃, +105℃, +125℃の各温度において、周波数1kHz、電圧 (実効値) 1.0 Vの条件で静電容量を測定し、20℃ 及び25℃の時の静電容量に対する各温度における変化 率を求めることによって得た。

20 【0035】(E) 125℃における直流破壊電圧は、2 0個の試料を125℃に保温したシリコンオイル中に浸 漬しながら、試料に印加する直流電圧を1秒当り100 Vの割合で昇圧して試料が絶縁破壊する(0.1 mAの 電流が流れた時)直前の電圧を測定し、誘電体層の厚み から1μm当りの換算値を求めた。

【0036】以上、実施例1について述べたが、実施例2~5についても、基本成分及び添加成分の組成を表1に示すように変えた以外は実施例1と同様にして積層磁器コンデンサを作成し、その電気的諸特性を調べた。結果は表2に示す通りとなった。

【0037】ここで、実施例2は、基本成分として(Ba_{0.96}Mg_{0.03}Zn_{0.01}Ca_{0.01}Sr_{0.01})O_{1.02}(Ti_{0.98}Er_{0.02})O_{1.99}だけを用い、添加成分としてLi₂-SiO₂-SrOだけ用いたものである。

【0038】実施例3は、第1基本成分として(Ba 0.99Mg0.005 Sr0.005)O1.00(Ti0.98Y b0.02)O1.99を、第2基本成分としてBaZrO3を 用い、添加成分としてB2 O3 - SiO2 - MgOだけ を用いたものである。

【0039】実施例4は、第1基本成分として(Ba 0.99Ca0.025 Sr0.005) O1.02 (Ti0.99D y0.01) O1.995 を、第2基本成分としてCaZrO3 を用い、第1添加成分としてB2 O3 - SiO2 - Ba O-CaO-MgOを、第2添加成分としてCr2 O3 及びA12 O3 を用いたものである。

【0040】実施例5は、基本成分として(Ba0.97M g0.03Ca0.02)O1.02(Ti0.96Y0.03Er0.01)O 1.98を用い、第1添加成分としてLi2 O-SiO2 -BaOを、第2添加成分としてCr2 O3 及びAl2 O 50 3 を用いたものである。

10

【0041】また、比較例1~5として、表1に示すように、基本成分及び添加成分の原料化合物を実施例1~5と同一になるように調製し、この原料化合物すべてを一度に混合し、1200℃で仮焼し、これを用いて積層*

*磁器コンデンサを作成し、その電気的諸特性を求めた。 その結果は表2に示す通りとなった。 【0042】 【表1】

	基本成分	\$						添加成分	
			第1成分の	第1成分の原料比 (モル比)				第1成分	第2成分
	組成式	BaTi0,	93	RgOs	Bao	130	飯屋部	組成比(モル比)	重都
実施例1	0,98 { (BaoseMeoseZnoo1) 0.02		MeO 0.05	Ho ₂ O ₃ 0.005		0.03	2	0.20Li ₂ 0-0.60Si0 ₈ - 0.04Sr0-0.10Mg0- 0.06Zr0	
干較例 1	- (TioseHosos) Osses +0.02CaZrOs		ZIO 0.01	"	0.96	0.99	"	"	
実施例2	(Baass Ngoos Znoo (Caos 1 Srao 1) 0 102	0.96	MgO 0.03 Zno 0.01 CaO 0.01 Sro 0.01	Er20a 0.01		0.02	"	0.30Li ₂ 0-0.45Si0 ₂ - 0.25SrO	
FF#2(9) 2	- (TiassEraaz) 0 1 0 9		"	"	0.96	0.98	"	"	
実施例3	0,98 { (BasseMgacosSrasse) 0,00	0.98	MgO 0.005 SrO 0.005	Yb203 0.01	0.01	0.98	0.5	0.208 ₂ 0 ₂ -0.50Si0 ₂ - 0.30MgO	
上的例3	- (Ti 0,9 a Y) a 0,2 9 o 1 + 0, 02 BaZrO3		"	"	0.39	0.98	"	ľ	
実施例4	0.98 ((Bass Caszs Sross) 0,02	0.99	Ca0 0.025 Sr0 0.005	Dy ₂ 0, 0.005			7	0.108,03-0.50S102- 0.08BaO-0.20CaO- 0.12MgO	Crz0a 0.1
比較例4	- (TipseDyoo1) 0 tess) +0. 02CaZrUs		"	"	0.93	0.99	2	"	
実施例5	(Bage 1 Mgag 3 Cago 2) 0 1.02	0.96	MgO 0.03	Y20, 0.015 Er20, 0.005	0.01	0.96	n	0. 25Li _* 0-0. 50S10 ₂ - 0. 25Ba0	Ala0a 0.9
比較例5	- (Tio,eeYoo3Eron1)U.sa		11	"	0.97	0.36	*	"	"

	該電車	tanδ	抵抗率ρ	ΔC-58	AC126	A C - 25	ΔCss	直流破塊電圧(V/m)	(王 (V/ gra)
	3	(%)	(MQ·cm)	8	8	(%)	(%)	平均值	最小值
実施例1	3950	1. 2	5.3×10°	-10.1	3.5	-3.6	-4.2	64	55
比較例 1	3890	1.0	5.6×10	-11.0	1.3	-4.4	-4.8	19	2.7
実施例2	3530	1.1	3.3×10°	-9.5	3.6	-4.5	-4.1	65	5.7
比較例2	3490	1.1	3.2×10*	-11.0	3. 3	-5.6	-4.5	0 9	25
実施例3	4360	1. 2	2.5×10°	-10.0	9.3	-6.3	3.6	58	5 1
比較例3	4300	1.1	2.7×10°	-10.7	8.9	-7.1	3.9	5 5	33
実施例4	3720	1.1	2.2×10 ⁶	_ 9 ව	5.0	-3.8	-0.6	0.9	52
比較例4	3660	1.1	1.7×10 ⁶	-10.8	4. 0	-5.0	-2.4	58	35
実施例5	3600	1. 2	5.0×10ª	-9.4	3.9	-5.5	-3.3	5.8	49
光較多5	3480	1:1	5.4×10°	-10.5	3. 7	-6. 7	-3.8	55	33

【0044】表2から、実施例1~5は比較例1~5と比較して、125℃の直流破壊電圧の最小値が大幅に増大して直流破壊電圧のバラツキが大幅に減少し、また、直流破壊電圧の平均値も増大していることがわかる。

【0045】次に、実施例1~5で得られた積層磁器コンデンサの誘電体層の微細構造について調べた。まず、 X線マイクロアナライザーにより、誘電体層の全体的な 元素分布を調べたところ、いずれの試料においても組成 分布のマクロなバラツキは認められず、均一であること がわかった。なお、従来法によって製造した誘電体磁器 組成物中においては、通常、1~2μmの固まりでM成 分、R成分の偏析が生じ、全体的な組成の均一性が失わ れている。

【0046】更に、分析電子顕微鏡を用いてEDS法

(エネルギー分散型X線分光法)により、結晶粒1個1個の組成の分析を行なったところ、多くの結晶粒において結晶粒内部と結晶粒シェル部で組成の異なるいわゆる40 コア・シェル構造が認められた。

【0047】図1に、実施例1の試料の電子顕微鏡写真を示す。この電子顕微鏡写真からわかるように、結晶粒のコア部(A部)にはドメイン・ウォール(domain wall)であるところの複数のすじが見られ、これによって双極子モーメントが特定方向に分極した「強誘電性」を示すドメイン(分域)が存在することがわかる。結晶粒のシェル部(B部)にはそれが見られない。

【0048】図2は図1の矢印Aで示された部分のED Sスペクトルを示すグラフ、図3に図1の矢印Bで示さ 50 れた部分のEDSスペクトルを示すグラフである。図2

1/

に示すように、結晶粒のコア部(A)のEDSスペクトルからはBa及びTiのスペクトルしか観察されないのに対し、図3に示すように、結晶粒のシェル部(B)のEDSスペクトルにおいては、Ba, Ti, Ca, Zr, Ho等のスペクトルが見られる。即ち、BaTiO3結晶粒に対し、基本成分で添加しているM成分、R成分及びCaZrO3成分が部分的に拡散した構造となっていることがわかる。

13

【0049】即ち、結晶粒のコア部はほとんどBaTiO3成分から成り、結晶粒のシェル部は $BaTiO_3$ と 10基本成分の第1成分のM成分、R成分の固溶体、または $BaTiO_3$ と基本成分の第1成分のM成分、R成分及 び基本成分の第2成分の ZrO_2 との固溶体から形成されていることがわかる。

【0050】更に、比較例~5の試料について実施例1~5と同様にして分析顕微鏡による微細構造の観察を行なったところ、部分的にコア・シェル構造がみられるものがあるものの、明確にコア・シェル構造と認められる結晶粒の数は、実施例1~5のものに比べてかなり少なかった。

【0051】図5は比較例の試料の電子顕微鏡写真を示し、図6は図5のA部のEDSスペクトルを示すグラフ、図7は図5のB部のEDSスペクトルを示すグラフである。図5及び図7からわかるように、比較例の試料ではB部(シェル部に相当)にR成分(Ho)の固溶がみられず、試料中におけるR成分の分布が不均一になっていることがわかる。なお、R成分の分布が不均一になってくると、局部的な還元作用を生じ、特性(高温下での信頼性)のバラツキの原因となる。

【0052】以上から、本発明に係る実施例1~5によれば、誘電体層の基本成分の第1成分のM成分、R成分の分布のバラツキが見られず、BaTiO3結晶粒のシェル部にM成分、R成分及び基本成分の第2成分が拡散

した構造からなるセラミックを主成分とするので、125℃における直流破壊電圧のバラツキが少なく、温度特性の平坦な磁器コンデンサが得られることがわかる。 【0053】

【発明の効果】この発明によれば直流破壊電圧のバラッキが小さくなるとともに、そのレベルが向上し、しかも静電容量の温度変化率も若干改善されるので、従来のものより更に小さい磁器コンデンサを提供することができるという効果がある。

0 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1に係る誘電体磁器組成物の電子顕微鏡 写真である。

【図2】実施例1に係る誘電体磁器組成物のセラミック 粒子のコア部のEDSスペクトルを示すグラフである。

【図3】実施例1に係る誘電体磁器組成物のセラミック 粒子のシェル部のEDSスペクトルを示すグラフであ る

【図4】実施例1に係る磁器コンデンサの断面図である。

20 【図5】比較例の試料の電子顕微鏡写真である。

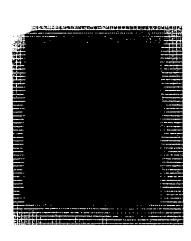
【図6】図5のA部のEDSスペクトルを示すグラフである。

【図7】図5のB部のEDSスペクトルを示すグラフである。

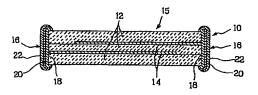
【符号の説明】

- 10 磁器コンデンサ
- 12 誘電体層
- 14 内部電極
- 16 外部電極
-) 18 亜鉛電極層
 - 20 銅層
 - 22 Pb-Sn半田層

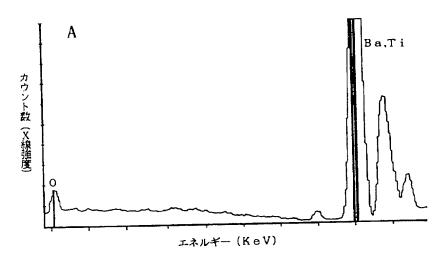
【図1】



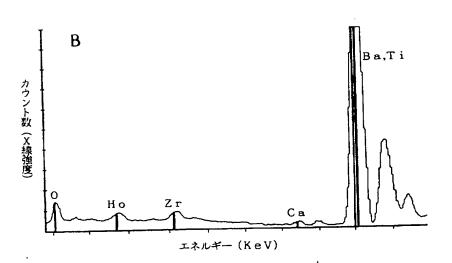
【図4】



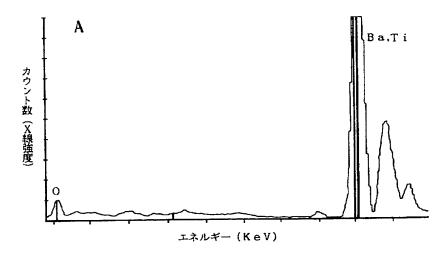
[図2]



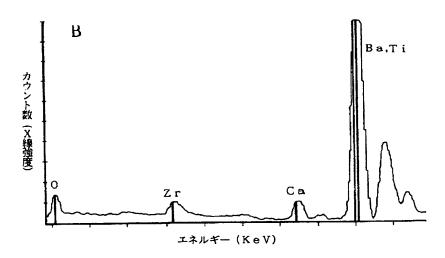
【図3】



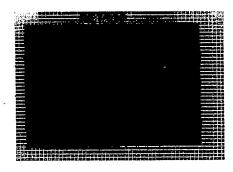
【図6】



【図7】



【図5】



【手続補正書】

【提出日】平成5年3月4日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図1

【補正方法】変更

【補正内容】

【図1】 実施例1に係る誘電体磁器組成物の結晶構造

を示す電子顕微鏡写真である。

*【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図5

【補正方法】変更

【補正内容】

【図5】 比較例の試料の結晶構造を示す電子顕微鏡写

真である。

フロントページの続き

(72) 発明者 西 湯二

東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内

(72)発明者 荒井 克彦

東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内